

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 3 月 25 日 (2021.3.25)

【公開番号】特開 2019-145328 (P2019-145328A)

【公開日】令和 1 年 8 月 29 日 (2019.8.29)

【年通号数】公開・登録公報 2019-035

【出願番号】特願 2018-28166 (P2018-28166)

【国際特許分類】

H 0 1 J 37/30 (2006.01)

H 0 1 J 37/28 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

H 0 1 J 37/147 (2006.01)

G 0 1 N 23/2251 (2018.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 J 37/30 Z

H 0 1 J 37/28 B

H 0 1 J 37/317 D

H 0 1 J 37/147 D

G 0 1 N 23/2251

H 0 1 L 21/66 J

H 0 1 L 21/66 N

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 2 月 5 日 (2021.2.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 4 3 】

再び図 3 を参照して、偏向電極（偏向手段）4 6 は、互いに対向して配された 1 組以上の平行平板電極から構成されている。この平行平板電極からなる偏向電極 4 6 は、電子ビーム鏡筒 1 5 からの漏れ磁場によってアルゴンイオンビーム（GB）が偏向する偏向方向（図 3 中の実線矢印 D 2 を参照）と逆の方向にアルゴンイオンビーム（GB）を偏向させる。

これによって、外部磁場によるアルゴンイオンビーム（GB）の偏向量と同一の偏向量となる磁場を発生させる電圧を偏向電極（偏向手段）4 6 に印加することで、アルゴンイオンビーム（GB）を用いた試料 S の加工時に視野補正を行うことができる。